Issue Classification



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent Under Reexamination
10812966	HUR ET AL.
Examiner	Art Unit
Bayat, Ali	2624

ORIGINAL					INTERNATIONAL CLASSIFICATION										
CLASS SUBCLASS								С	LAIMED			١	ION-	CLAIMED	
236 CROSS REFERENCE(S)				G	0	6	к	9 / 36 (2006.01.01)							
				G	0	6	к	9 / 46 (2006.01.01)							
CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK				OCK)	\vdash				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ļ <u>.</u>		
382	238	234	250	251											
348	402.1	40731								***				-	
								<u> </u>		- N D. /					
	1		1	1											
															· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
															<u> </u>
		·													
										77 70 0				1	
										- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
				-					_					-	
	1			T		 									
				<u> </u>			<u></u>								

					1			 						\vdash	
								\vdash						\vdash	
			1	 										†	
			-	+											
	1														
	1										<u> </u>		\vdash	 	
							<u> </u>								
				1				_					_		
-			1		†		 						\vdash		
			1	1									 	\vdash	
				 	<u> </u>			\vdash					\vdash	 	
			+					 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 	+-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 							<u> </u>		\vdash	\vdash	

Bayat, Ali (Assistant Examiner)	. 9/27/07 (Date)		Ma		•	P. 01		Total Cl	aims A 25	llowed:
Sharmer (Legal Instruments Examiner)	9.29.07 (Date)	(Primary Exami	ner) our	MAT	THEW C. B	ELLA EXAMINE	R	Print Clair	n(s)	O.G. Print Figure
J.S. Patent and Trademark Office				<u>rechno</u>	LOGY CEN	TER 2600L		1	Part	of Paper No. 20070927